



Laboratorio de LF


Los medios de medida estándar se pueden calibrar en casi todos nuestros centros de calibración.




Múltímetro analógico/digital

Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Múltímetro analógico		DAkks	VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 3	52,-
		ISO	VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 3	35,-
Múltímetro digital		DAkks	VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, Capacitancia, Frecuencia, Temperatura	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 3	80,-
		ISO	VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, Capacitancia, Frecuencia, Temperatura	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 3	38,-

Osciloscopio

Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Osciloscopio 1 a 4 canales		DAkks	hasta 50 GHz	Control efectuado acorde a la directiva DKD-R 1-2	180,-
		ISO	hasta 50 GHz	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 4	105,-


Frecuencímetro

Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Frecuencímetro		DAkks	hasta 50 GHz	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 7	115,-
		ISO	hasta 50 GHz	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 7	75,-

Pinza amperimétrica

Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Pinza amperimétrica		DAKKS/	hasta 100 A	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 15.	75,-
		ISO	hasta 1000 A	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 15.	36,-

Referencias de medida

Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Intensidad		DAkKS	100 $\mu\Omega$ hasta 100 Ω	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 8.	50,-
		ISO	>10A hasta 100 A 1 A hasta 10 A 1, 10 o 100A	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 8.	35,-

Resistencia

Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Resistencia		DAkKS	1 pF hasta 1 μ F	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkKS	230,-
		ISO	1 pF hasta 1 μ F	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkKS	50,-

Inductancia

Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Inductancia		DAkKS	100 μ H hasta 10 H	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkKS	175,-
		ISO	100 μ H hasta 10 H	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkKS	50,-

Objeto a calibrar		ENAC/ DAKKS/ ISO	Rango	Condiciones/ Procedimiento de medida	Precio a partir de
Equipos de medida de tierras, medidores de aislamiento		DAkKS	0...50 kV*	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 9	bajo petición
		ISO	0...50 kV*	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 9	bajo petición
Comprador de alta tensión		DAkKS	0...50 kV*	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkKS	bajo petición
		ISO	0...50 kV*	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkKS	bajo petición
Pico-amperímetro, nanovoltímetro, electrometro, medidor de pulsos, fuente pico-amperimétrica, analizador de red		DAkKS	1 pA ... 100 A 0,1 µA ... 1 mV	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkKS	bajo petición
		ISO	1 pA ... 100 A 0,1 µA ... 1 mV	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkKS	bajo petición
Registadores de trazos continuos, registradores XY		DAkKS	Todas las dimensiones físicas	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 21 (especialidades de ciertos modelos bajo demanda)	100,-
		ISO	Todas las dimensiones físicas	El control se realiza de acuerdo con la directiva VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, hoja 21 (especialidades de ciertos modelos bajo demanda)	75,-
Analizador		DAkKS	Según el equipo	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkKS	bajo petición
		ISO	Según el equipo	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkKS	bajo petición
Fuentes de alimentación		DAkKS	Fuentes	Dependiendo de la calibración del dispositivo se realiza mediante mediciones comparativas con referencias y estándares PTB/DAkKS	bajo petición
		ISO	Fuentes	La calibración de la cámara se realiza mediante mediciones comparativas con las referencias y estándares PTB/DAkKS	bajo petición

*previsto para 2012